

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/2

品名<Model Name> (LCRハイテスタ<LCR HiTESTER>)
 形名<Model Number> (3511-50)
 製造番号<Serial No.> (No. 110415275)
 検査年月日<Test Date> (2011-04-12)
 (<YYYY-MM-DD>)
 検査条件<Test Conditions> (23.8 °C, 43 %rh)
 測定信号レベル (1 Vrms)
 <Measurement Signal Levels>

レンジ <Range>	周波数/モード <Freq/Mode>	入力 <Input>	(標準器校正値) <Std. Cal. Value>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
確度<Accuracy>					
100mΩ	120 Hz	Z	50mΩ (0.04958 Ω)	0.0476 Ω ~ 0.0515 Ω	(0.0496 Ω)
		θ	(-0.019 °)	-1.93 ° ~ 1.89 °	(0.00 °)
	1kHz	Z	50mΩ (0.04950 Ω)	0.0476 Ω ~ 0.0514 Ω	(0.0495 Ω)
		θ	(-0.034 °)	-1.95 ° ~ 1.88 °	(-0.07 °)
1 Ω	120 Hz	Z	500mΩ (0.49744 Ω)	0.4885 Ω ~ 0.5063 Ω	(0.4974 Ω)
		θ	(-0.023 °)	-1.02 ° ~ 0.97 °	(-0.03 °)
	1kHz	Z	500mΩ (0.49734 Ω)	0.4884 Ω ~ 0.5062 Ω	(0.4974 Ω)
		θ	(0.000 °)	-1.00 ° ~ 1.00 °	(0.00 °)
10 Ω	120 Hz	Z	5 Ω (5.00309 Ω)	4.9856 Ω ~ 5.0206 Ω	(5.0031 Ω)
		θ	(-0.024 °)	-0.20 ° ~ 0.15 °	(-0.01 °)
	1kHz	Z	5 Ω (5.00296 Ω)	4.9855 Ω ~ 5.0204 Ω	(5.0028 Ω)
		θ	(-0.003 °)	-0.18 ° ~ 0.17 °	(0.00 °)
100 Ω	120 Hz	Z	50 Ω (50.0016 Ω)	49.962 Ω ~ 50.041 Ω	(49.998 Ω)
		θ	(-0.024 °)	-0.10 ° ~ 0.05 °	(-0.03 °)
	1kHz	Z	50 Ω (50.0016 Ω)	49.962 Ω ~ 50.041 Ω	(49.998 Ω)
		θ	(-0.003 °)	-0.08 ° ~ 0.07 °	(0.00 °)
1kΩ	120 Hz	Z	500 Ω (499.837 Ω)	499.44 Ω ~ 500.23 Ω	(499.82 Ω)
		θ	(-0.024 °)	-0.07 ° ~ 0.02 °	(-0.02 °)
	1kHz	Z	500 Ω (499.852 Ω)	499.46 Ω ~ 500.25 Ω	(499.85 Ω)
		θ	(-0.003 °)	-0.05 ° ~ 0.04 °	(0.00 °)

総合判定<Overall Result>

(PASS)

検査者<Inspected by>

()

承認者<Approved by>

()

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

2/2

製造番号<Serial No.> (No. 110415275)
 検査年月日<Test Date> (2011-04-12)
 <YYYY-MM-DD>

レンジ <Range>	周波数/モード <Freq/Mode>	入力 <Input>	(標準器校正値) <Std. Cal. Value>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
確度<Accuracy>					
10kΩ	120 Hz	Z	5kΩ (4.99719 kΩ)	4.9917 kΩ ~ 5.0026 kΩ	(4.9969 kΩ)
		θ	(-0.024 °)	-0.10 ° ~ 0.05 °	(-0.03 °)
	1kHz	Z	5kΩ (4.99712 kΩ)	4.9917 kΩ ~ 5.0026 kΩ	(4.9970 kΩ)
		θ	(-0.003 °)	-0.08 ° ~ 0.07 °	(-0.01 °)
100kΩ	120 Hz	Z	50kΩ (50.0009 kΩ)	49.931 kΩ ~ 50.070 kΩ	(49.990 kΩ)
		θ	(-0.025 °)	-0.12 ° ~ 0.07 °	(-0.04 °)
	1kHz	Z	50kΩ (50.0003 kΩ)	49.931 kΩ ~ 50.070 kΩ	(49.991 kΩ)
		θ	(-0.009 °)	-0.10 ° ~ 0.09 °	(-0.02 °)
1MΩ	120 Hz	Z	500kΩ (499.895 kΩ)	498.40 kΩ ~ 501.39 kΩ	(499.81 kΩ)
		θ	(-0.029 °)	-0.21 ° ~ 0.16 °	(-0.04 °)
	1kHz	Z	500kΩ (499.888 kΩ)	498.39 kΩ ~ 501.38 kΩ	(499.81 kΩ)
		θ	(-0.025 °)	-0.21 ° ~ 0.16 °	(-0.03 °)

項目 <Item>	周波数 <Frequency>	設定 <Set Value>	許容範囲 <Tolerance>	測定値 <Measured Value>
測定信号レベル	120 Hz	50 mV	0.040 V ~ 0.060 V	(0.047 V)
<Measurement signal level>	120 Hz	500 mV	0.445 V ~ 0.555 V	(0.486 V)
	120 Hz	1 V	0.895 V ~ 1.105 V	(0.972 V)
	1 kHz	50 mV	0.040 V ~ 0.060 V	(0.049 V)
	1 kHz	500 mV	0.445 V ~ 0.555 V	(0.498 V)
	1 kHz	1 V	0.895 V ~ 1.105 V	(0.996 V)
測定周波数	120 Hz		119.988 Hz ~ 120.012 Hz	(119.999 Hz)
<Measurement frequency>	1 kHz		0.99990 kHz ~ 1.00010 kHz	(1.00000 kHz)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

標準器校正値を使用しているポイントの許容範囲は、標準器校正値を基準に定めています。

<The tolerance for each point using the standard calibration value is based on the standard calibration value.>

確度において、Zおよびθの2つのパラメータのみ検査を実施していますが、仕様に規定されている全パラメータについて確度保証しています。

<Although Z and θ are the only two parameters inspected for accuracy, all parameters stipulated in the specifications are guaranteed for accuracy.>